

### 新芳奈米輻射除轉墊

搭配抗電磁波裝置

電腦、手機族專用

<量子傳輸>遠紅外線新技術-消除電磁波轉換成遠紅外線

聯合國208號文件發佈電磁波對人體健康造成嚴重傷害。 經常使用電腦之上班族,致使靜電電磁波之輻射停留在人體, 干擾血液循環且全身不舒服。長期暴露在電磁波的環境下會 造成肩頸緊繃、五十肩、手臂疼痛、後腦勺不舒服、眼睛疲 勞,嚴重者有致癌之風險。

1



### 新芳推出的輻射除轉塾以人類的健康為訴求

#### 敬邀各界支持反輻射抗電磁波產品之推動

由於現代人對電磁波輻射傷害的常識欠缺,因社會大眾處於無知及無感的狀態,由國內各大學教授發起聯名簽署支持產業推動,呼籲社會大眾重視生活中看不到的輻射隱形殺手,對人體健康造成深遠的影響。

新芳奈米科技推出的輻射除轉墊是一種抗輻能板,可促進血液循環活化末稍神經,預防心血管疾病,帶給全民健康。由於一般人每天工作環境接觸輻射源,所以該產品設計成桌墊形式放於電腦桌前使用,防止因上班時間使用電腦或午休趴睡於電腦螢幕前受輻射線的直接傷害,本產品除了消除電磁波之輻射,並將其電能輻射轉換成有利人體之遠紅外線(助於舒眠),提供上班族最安全的辦公環境及休息空間,和一般市面上的抗電磁波產品絕然不同。

至今各國研究單位及社會大眾還對電磁波輻射對人體的傷害抱持懷疑的態度,今天就透過影片的呈現方式讓大家親自見證及了解,電磁波是如何停留在腦部並直接對人體造成傷害,同時新芳奈米科技對此已研究到成熟的階段,足以證實聯合國208號文件發佈之電磁波會甘擾血液循環,造成心血管疾病等問題,長期接觸嚴重還有致癌的風險。

心血管疾病是即刻要人命,癌症雖不會即刻要人命,但會給家人帶來極大的精神打擊及經濟負擔,以及國家全民健保龐大的醫療給付,消耗社會成本。因此大家要知道預防勝於治療才是健康的根本,也就是預防醫學的重要性。



### 新芳抗電磁波暨散熱技術發表會

### 輻射除轉墊相關系列產品

鐵的見證-國家標準檢驗局核發專利證書並蒞臨新芳奈米科技有限公司證實其抗電磁波轉換成遠紅外線之卓越功能,此預防醫學之重大發明將帶給社會大眾健康。

2012年新芳公司發表反輻射抗電磁波技術,總統府指示行政院、經濟部標準檢驗局第六組電磁科謝翰璋組長擔任總召集,台電洪堯經理,工研院量測中心主任陳朝榮先生、成大王覺寬教授、清大謝光前教授與會等聯合見證發表,電磁波3G吸收隔離度達99dB,本公司的研發技術已超越國際水平,遠離輻射線傷害,帶給全民健康,社會大眾可以安心使用。



### 新芳抗電磁波暨散熱技術系列產品發表會



2012/04/18行政院經濟部標準檢驗局蒞臨新芳抗電磁波暨散熱技術發表會

成功大學航空太空研究所-王覺寬教授 清華大學奈微米中心主任-謝光前教授 謝光宇

工研院-量測中心- 陳朝榮教授 經濟部標準檢驗局第六組電磁科- 謝翰璋組長 陳誠章 唐永奇 台南分局- 洪飛良 林昆平 台灣電力公司- 洪堯經理 電磁專家- 楊金石主任 散熱方面專家- 王派毅 永記造漆-研發部協理- 曾世裕協理 藍揚企業有限公司-謝碧蓮董事長 榮星電線工業股份有限公司- 邱守基執行副總經理 黃維民業務經理

#### 應用材料部門最新研發



#### New

### 新芳微奈米化的製造與應用·乾式研磨

在紡織抽紗過程中最易遇到的斷紗情形, 可採用新芳超微研粉系統,利用顆粒間乾 式研磨分子擠壓撞擊法,對於功能性紡織 添加材料,經過此循環均質研磨系統、 小粒徑曲線分布範圍,使細度提升、粒徑 尺寸更均匀集中,可有效去除粉體百分比 中極少數的大顆粒。添加於高分子中可強 化紗線韌性、防止斷紗現象。







# 新芳微奈米系統製造研粉加工中心

- ■獨立隔間,防止生產環境粉體材料交互污染。
- ■電腦化精控·品質嚴格控管·UV 減菌照射·系統 全程百動 開啟·附有溫溼度控制系統·確保材料品質的保存。
- ■無任何塑膠元件接觸、管線、收集、包裝暨機械零件汗染,符合 GMP廠で系統需求,環保、工安及環境衛生面面俱到。
- ■專業製造微奈米化粉體設備及優良的整廠規劃・更為因應廠商面臨塑化風波で生產困境・附設微奈米研粉 加工中心・供業界生産及研究使用。
- ■全廠無塑化で標準校正・確保粉體生産で最高品質・符合國際化標準安全健康で製程。



發明人張仁鴻生技學博士





# 微奈米特殊超微研粉機-系統整廠輸出

提升產品功能性 强

验化產業競爭力

國際專利-微奈米特殊超微研粉機~加工應用範圍與專利技轉

微奈米材料製造與應用

生技保健

抗輻射電磁波(EMI)

微奈米研粉代工

醫學及保養&保健專利

抗電磁波及猿紅外線專利

微奈米化研粉專利製程

心血管疾病防治材料

抗電磁波及猿紅外線材料

有機、無機類專業代工研粉

貝詩娜保養品&SPA系列 生技保健品 醫學貼布 醫學流紅外線系列產品 新芳奈米輻射除轉墊 抗電磁波系列產品 抗靜電塗料 各項猿紅外線產品

依廠商需求設定細度規格 (製成食衣住行應用產品)



### 新芳超微研粉系統粒徑功能認證

#### 新芳超微研粉機的機械性能

本公司超微研粉機的研粉功能,以顆粒數比率為標準,粉體粒徑達 100 nm D50 以下,

通過 TAF 和 ILAC 認證

送件單位:新芳奈米科技有限公司

委託項目: FE-TEM 分析

型號:新芳微奈米珍珠粉

分析原因:鑑定珍珠粉的粒徑大小

檢驗結果:請參閱表一

\*TAF全國認證基金會

ILAC國際實驗室認證聯盟





### TAF與ILAC-MRA國際認證

#### 以下為全國認證基金會(TAF)的介紹

全國認證基金會(TAF)認證

「財團法人全國認證基金會」(TAF)推動國內各類驗證機構、檢驗機構及實驗室各領域之國際認證,並透過國際實驗室認證聯盟相互承認協議(ILAC-MRA),TAF認證可在全球51個經濟體65個認證組織獲得相互承認,包括日本(JAB, IAJapan 和VLAC)、美國(A2LA, NVLAP, IAS, ACLASS, L-A-B, PJLA, ASCLD/LAD)、英國(UKAS)、中國大陸(CNAS)、香港(HKAS)、新加坡(SAC)、韓國(KOLAS)等。

ISO-ILAC-IAF國際認證聯盟對ISO/IEC 17025:2005 管理系統需求及實驗室測試與校正的一般要求中提到,當實驗室符合ISO/IEC 17025: 2005 規定時,意味此實驗室能達到技術能力及管理系統之要求,且其技術足以穩定提供可靠的測試結果及校正服務。



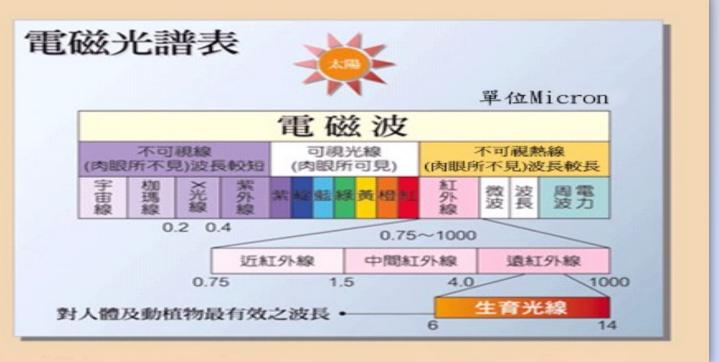


#### 認證項目:

- 細胞增生/毒性檢測
- 基因表現檢測
- 細胞族群比例分析檢測
- 自然殺手細胞毒殺能力檢測
- 蛋白質表現檢測 (細胞激素和免疫球蛋白)
- 徽聚菌檢測
- 內毒素檢測



# 關於電磁波



電磁波,又稱電磁輻射,是由同相震盪且互相垂直的電場與磁場在空間中以波的形式傳遞能量和動量,其傳播方向垂直於電場與磁場構成的平面。電磁輻射的載體為光子,不需要依靠介質傳播,在真空中的傳播速度為光速。電磁輻射可按照頻率分類,從低頻率到高頻率,主要包括無線電波、微波、紅外線、可見光、紫外線、X射線和伽馬射線。人眼可接收到的電磁輻射,波長大約在380至780nm之間,稱為可見光。只要是本身溫度大於絕對零度的物體,都可以發射電磁輻射,而世界上並不存在溫度等於或低於絕對零度的物體。因此,人們周邊所有的物體時刻都在進行電磁輻射。儘管如此,只有處於可見光頻域以內的電磁波,才可以被人們肉眼看到。



# 關於可見光-電磁波

380	٧	450	В	495	G	57 <b>Y</b> 88	0 %	R	750
			Ш	Ш					

顏色	頻率	波長
紫色	668–789 THz	380–450 nm
靛色	631–668 THz	450–475 nm
藍色	606–630 THz	476–495 nm
綠色	526–606 THz	495–570 nm
黃色	508–526 THz	570–590 nm
橙色	484–508 THz	590–620 nm
紅色	400–484 THz	620–750 nm

- \* 高頻光-如藍光、紫光, 具有高穿透力,對人體 造成傷害。 波長500nm以下已開始 對人體造成影響。
- \* 新芳奈米輻射除轉墊, 依<mark>高吸光係數及低折射</mark> 率的原理,減少光對人 體的傷害。



#### 太陽光=高頻電磁波輻射

#### 新芳奈米輻射除轉墊可吸收太陽光輻射及高壓電輻射





#### 實驗基礎:

戶外溫度:約35度~37度 使用儀器:高頻測試儀器

儀器使用範圍: 800MHz~2500MHz = 0.8G ~ 2.5G (1000MHz=1G)

實驗結果: 未使用新芳奈米輻射除轉墊, 測得結果132 µ w,經使用新芳奈米輻射除轉墊, 測得結果29 µ w ,表示新芳奈米除轉墊設計高吸光係數與低折射率之原理,可有效吸收太 陽光中電磁波之頻率與波長。即表示新芳奈米輻射除轉墊具有吸收高頻光的能力。本產品 置於螢幕前,作為辦公墊使用,達到降低光害,保護眼睛及防止電磁波傷害的效果,並能 轉換成遠紅外線有益人體。



# 電磁波對人體影響質驗圖:圖論

中樞神經 難入睡.無力.多汗.記憶力減退

免疫功能 下降,抗體形成受抑制

心血管 血壓波動、心血管疾病

血液 白血球減少,紅血球生成受抑制....

生殖.遺傳 男性性機能降、女性月經週期亂

視覺 眼温易升高,視覺疲勞、乾燥不適

致癌.治癌 染色體突變,但微波致熱效應,也可治癌



### 聯合國-電磁波對人體的危害

 2011/5/31—國際癌症研究署(International Agency for Research on Cancer; IARC)
 於2011年5月31日發布208號文件,依據使用無線手機與增加罹患神經膠質瘤之風險, 已將射頻電磁場歸類為「人類可能致癌物」(人類致癌因子分類表為2B)

#### 世界衛生組織 (WHO) 文件

電磁場(波)之間的關係,不僅我國民眾關心,在世界各地也都受到高度重視,因此世界衛生組織(WHO)自 1996 年開始「國際電磁波計畫」(International EMF project)跨國之研究,全世界有54個國家、8個國際研究組織共同參與。此計畫提供各界有關風險認知、風險海通、風險管理的資訊,是目前全球最完整、客觀且具科學根據的參考資料來源。

國際癌症研究署(International Agency for Research on Cancer; IARC)於2011年5月31日發布208號文件,依據使用無線手機與增加罹患神經膠質瘤之風險,出將射頻電磁場解類為「人類可能致癌物」(人類致過因分分類表為2B)。對對使用行動電話者乙研究類亦,與重量級之重度行動電話使用者中(每天使用超過30分鐘且使月10年以上),有增加40%罹患神經膠質瘤的風險。依IARC專刊工作小組總主席,Jonathan Samet博士指出必續持續發容關注行動電話與癌症團檢之關聯性。

茲就IARC對2B級人類致癌物質之歸類說明及範例摘述如下:

歸類級別	歸類說明	範例
2B 級 <b>可能</b> (possible)為 致癌因子	· 人體致產性的證據有限,且動物實驗的證據尚不充足。 · 人體致產性的證據不足,且動物實驗的證據充足。 · 有些情况下,其人體致癌證據不足,且動物實驗的致癌性證據也尚未充足,不過由於其在生物機轉與其此相關資料上具有強而有力的證據顯示其致癌傾向,仍可被歸於此類。	咖啡、苯乙烯、汽油引擎廢氣、電焊煙霧、極低頻電磁場(學)勝臂細胞瘤)、射頻電磁場(行動電話)。

世界衛生組織已就行動電話、射頻電磁波、基地臺、無線科技、極低頻電磁波發布193號、208號、296號、304號、322等號文件,其文件內容主題說明如下:

- 1.2011年發布之第193號文件:行動電話〔射頻〕。
- 2.2011年發布之第208號文件:將射頻電磁場歸類列為人類可能致癌因子。
- 2、2011年5月1日之7月20日362人1年 7月319月电域初期4月7139八代月刊70年入22日 2、2022年70年20日2日2日2日2日2日2日
- 3.2007年發布之第322號文件:極低頻電磁場的暴露(極低頻)。
- 4.2006年發布之第304號文件:基地臺及無線科技(射頻)。
- 5.2005年發布之第296號文件:電磁場過敏症(高、低頻)。



#### 電磁波對人體的危害

根據【電磁波風險評估報告】與 【德國健康住宅協會】之建議及說明, 長期暴露於電磁波底下,可能會造成 <mark>兒童白血病以及致癌</mark>,居住環境中的 低頻電磁波強度應低於1mG,而射頻 電磁波更不應高於5µW/m²,才能保 障居民免於電磁波的危害!

#### 不容輕忽的危害

因工作需長期使用電腦之行政人員、處於資訊教室或沉浸於電腦遊樂場之學童,在電磁波長期危害之下對於未來的健康更是一大堪慮,根據2004年國際癌症預防雜誌的文章指出,長期處於3~4千µW/m²的電磁波環境中,就足以讓癌症發生率增加4倍以上環境接近高壓電線或較多電磁波環境中的孩子,罹患白血病的機率更為平均值2倍以上;電磁波對人體雖無立即性之傷害,但長期累積下來對於健康將造成無法挽回之危害,因此電磁波對人體有害之影響絕不容忽視!!

#### 耳朵

耳鳴、平衡感失調。

#### 眼睛

易造成晶狀體衰老和混濁 產生視覺疲勞甚至失明。

#### 丽

<mark>頭痛、頭暈、記憶力減退</mark> 甚至易產生老年痴呆症。

#### 弱節

手臂肩頸之肌肉關節<sup>、</sup>神經疼痛。

#### 心臟

阻<mark>礙血液循環,心律不整、</mark>呼吸困難、造成心血管疾病。

#### 抵抗力下降

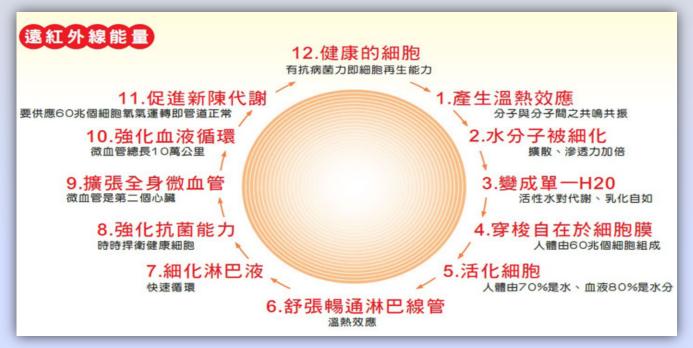
免疫系統被破壞 增加致癌機率。

#### 皮膚

易造成皮膚疹。 皮膚病變等。



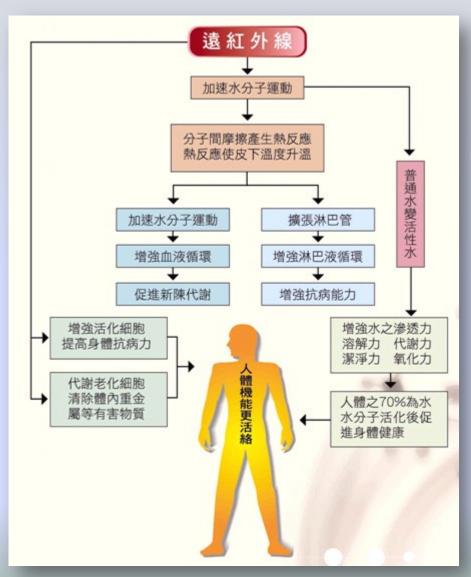
### 電磁波與遠紅外線對人體的影響



因靜電場輻射會干擾人體血液循環,改變人體體表電位,影響心肌 正常的生理過程,極有可能引起心律異常,傷害人的中樞神經,使 人感到疲勞、煩躁和頭疼而干擾人的情緒。新芳奈米除轉墊針對此 點,設計出抗輻射電磁波及遠紅外線雙重功能,引領業界潮流!

### 電磁波未消除,遠紅外線功能即不能發揮!





\*微奈米珍珠粉釋放遠紅外線之生育波長 高達約95%可促進細胞活化、修護、美白、抗衰老之功能。

\*紅光外側的光線是不可見光, 科學家稱為生命光線。

\*波長由0.76~1000µm稱為紅外光,當中4~400µm的波長稱為遠紅外光,其中90%的波長介乎8~14微米,科學家稱為生命光線(因為這波長的光線,能促進動物及植物的生長),每一秒鐘能震動10½次方之頻率,肉眼無法見到,屬於超短波有益人體。

\*人體主要由水及蛋白質構成,還包括鈣、鐵、鈉、鉀等微量元素,能發出5µm至30µm的遠紅外線能量。

根據物理學理論,微奈米珍珠 粉具有相同的成分特性波長產 生分子共振,人體因而能大量 吸收5~30µm的遠紅外線光, 促進細胞活化的功能。



# 新芳奈米輻射除轉墊

新芳運用最新奈米科技,成功研發抗電磁波奈米材料,獲得國際SGS認證,證明新芳抗電磁波奈米材料吸附功能隔離度高達99.66%。利用專利(證號:TW I401701)的抗電磁波、抗靜電的高低頻基材的防護,即可發揮阻隔、遮蔽、吸附、抗靜電的有效功能,並引用新發明醫學專利(證號:TW I446933)將生育光波精準定位為通過8至12µm且達到約91%放射率。

新芳奈米輻射除轉墊釋放遠紅外線之生育波長高達約 91%,可活化生理機能。

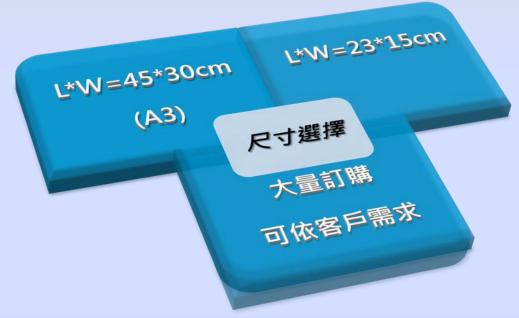
# 最新奈米科技,擁有國際專利



# 產品規格尺寸

產品材質: 環保PP(硬墊) PVC(軟墊)







# 產品特色

微奈米珍珠粉封 吸收光害(保護眼睛) 換成遠紅外線 防偽標章



# 產品特色

新芳所研發出的隱形材料,能吸收光所產生的電磁波之頻率與波 長,降低螢幕的光害。繼而開發出奈米輻射除轉墊,體觸部分以 利於肌膚之微奈米珍珠粉做墊體表面封膜,減少化學汙染傷害, 符合ROHS。藉由控制吸光係數與折射率來降低螢幕光害。消除 暴露於自然環境中(電燈光害、周邊電器及線路)所產生之電磁波 及靜電場輻射,讓長期使用電腦工作者遠離電磁波的威脅並降低 螢幕所產生之光害來保護眼睛,本墊體能釋放遠紅外線,配合可 消除電磁波的裝置,利用電磁波繞射爬行的特性將3C產品所產 生之電磁波導引入地線孔(接地孔)移除。 本產品亦可依客戶需求印製LOGO或造型圖騰。 產品均有防偽標章以杜絕不肖業者侵權或仿冒!

本產品為電腦周邊產品,適合居家及辦公室,有3C輻射,如電腦,電視威脅的電磁波環境下均可使用!



### 筆記型電腦電磁波量測對照



筆電開機狀態,未使用新芳奈米輻射除轉墊及 抗電磁波裝置,電磁波量測值高達464 V/m



筆電開機狀態,經使用新芳奈米輻射除轉墊及抗電磁波裝置,電磁波量測值大幅降至5 V/m



"電磁波在腦裡" 使用筆電量測對照



距離筆電約1米半距離,

人體腦部電磁波量測值達

8V/m

磁波量測值達283V/m

接觸筆電後,人體腦部電

導電單插頭請插入經檢電 筆檢測之地線孔插座 轉換端子 導電夾

筆電開機狀態,經使用新芳奈米輻射除 轉墊及抗電磁波裝置,人體腦部電磁波 量測值大幅降至6 V/m



### 平板手機電磁波量測對照





平板手機充電狀態,未使用新芳奈米輻射除轉墊及抗電磁波裝置,電磁波量測值高達 176 V/m 平板手機充電狀態,經使用新芳奈米輻射除轉墊及抗電磁波裝置,電磁波量測值大幅降至2 V/m,可防止手機平板在充電過程中所形成的低頻電磁波



### 坐地式電腦主機電磁波量測對照





坐地式電腦主機開機狀態,未使用新芳奈米輻射除轉墊及抗電磁波裝置,電磁波量測值高達513 V/m

坐地式電腦主機開機狀態,經使用新芳奈米輻射除轉墊及抗電磁波裝置,電磁波量測值 大幅降至6 V/m



### 液晶電視機電磁波量測對照





液晶電視開機狀態,未使用新芳奈米輻射除轉墊及抗電磁波裝置,電磁波量測值高達 552 V/m 液晶電視開機狀態,經使用新芳奈米輻射除轉墊及抗電磁波裝置,電磁波量測值降低至 3 V/m



### 影印機電磁波量測對照





影印機待機狀態,未使用新芳消除電磁波裝置,電磁波量測值高達443 V/m

影印機待機狀態,經使用新芳消除電磁波裝置,電磁波量測值大幅降至5 V/m



### "電磁波在腦裡"使用影印機量測對照



離影印機約一米半距離, 人體腦部電磁波量測值達 17V/m



接觸影印機後,人體腦部電磁波量測值達238V/m



接觸影印機後,經使用抗電磁波裝置, 人體腦部電磁波量測值大幅降至5 V/m



# 量測儀器認證書



以上實驗所用儀器,符合國際VDE認證,所量測之數據,絕無誇大不實!



# 安裝注意事項

- 1.請先檢查總電源控制箱及各聯結電源,是否已做好接地裝置,使各插座的負電端兼有接地功能,亦可尋求專業水電人員或本司專業銷售人員協助安裝,做好電源安全檢查後再使用本產品,避免發生危險。
- 2.務必遵守使用說明之內容,並先使用檢電筆檢測出插座地線孔位置,特別注意將導電單插頭插於地線孔,請勿插於亮紅燈之火線孔,避免跳電危險。
- 3.如需保養墊體,請先拔除消除電磁波線組,再以<u>清水</u> 擦拭保養墊體。
- 4. 請勿放置高溫物品(攝氏50度C以上)於產品上,以免破壞產品美觀。



# 安裝注意事項

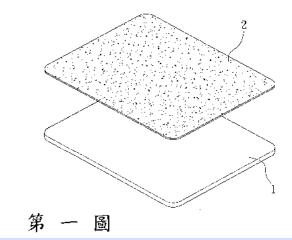


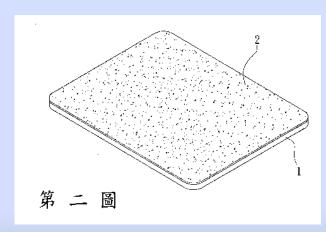


- \*請先以檢電筆測試出地線孔。
- ◇\*將導電單插頭插於插座之地線孔(水線)位置。
  - \*請勿插於亮紅燈之火線孔,避免跳電危險。

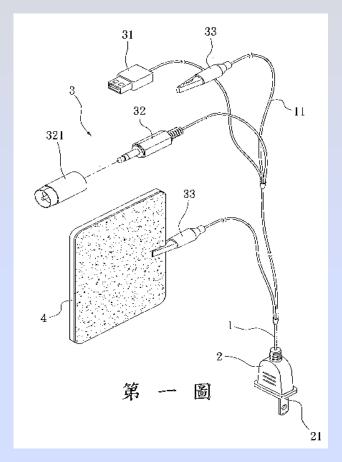
\*注意!現今水電工程插座施工常見未遵循標準線孔安裝方式。 使用本抗電磁波裝置,請務必用檢電筆測量火線與地線孔的正確位置。







消除電磁波轉換成遠紅外線之墊體

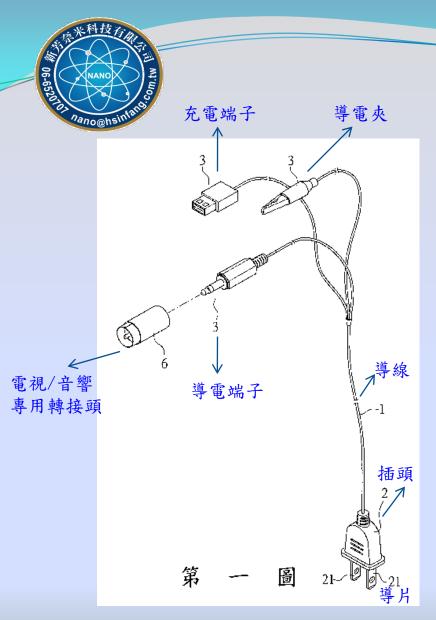


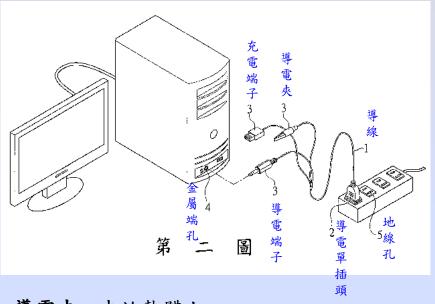
32 插於電腦或手機的耳機孔

33 夾於墊體上

32與321結合可插於電視或音響訊號孔 (消除電視之電磁波)

消除電磁波裝置(含墊體)





導電夾:夾於墊體上

導電端子: 插於電腦或手機的耳機孔

電視/音響專用轉接頭:與導電端子結合後可插於電視或音響訊號孔

可消除墊除電磁波的裝置(線組)



# 榮獲專利

- \* 2012年--中國大陸-抗電磁波微粒材料
- \* 2012年--越南-抗電磁波微粒材料
- \* 2012年--澳門-抗電磁波微粒材料
- \* 2012年--韓國-抗電磁波微粒材料
- \* 2013年--抗電磁波微粒材料--專利證號 I401701
- \* 2015年--消除電磁波轉換成遠紅外線之墊體--專利證號 M495785
- \* 2015年--可消除電磁波的裝置--專利證號 M495065

#### ~~通過SGS國際認證~~

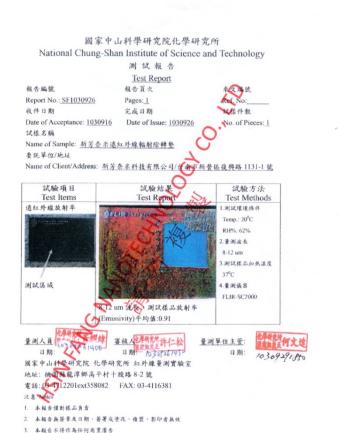
--測試頻率範圍100MHz-3GHz,電磁波遮蔽隔離度可達99.66%--

#### ~~符合ROHS歐盟多項環保檢測標準~~

--不含鎘、鉛、汞、六價鉻、多溴聯苯(PBB) 和多溴聯苯醚(PBDE)--



### 國家中山科學研究院 遠紅外線功能鑑定測試報告



驗證方法:用人體溫度37度C為標準,通過8~12微米之人 體遠紅外線生育波長可達91%以上,證明此墊體有體波 共振、體表升溫,促進血液循環,活化生理之機能。

#### 清華大學奈微與材料科技中心 產品功能認證書

國立清華大學奈微與材料科技中心 清奈材中心字第 1037000011 號 產品功能認證書 新芳奈米科技有限公司所研發之 新芳奈米輻射除 轉墊』, 具抗電磁波之靜電場輻射功能(發明專利證 書號數:TW [401701),可配合抗電磁放裝置線組使用,轉 化具防治心血管疾病之遠紅外線定位波長(醫學發明專利 證書號數:TW 1446933 B);具有 達到以生技替代醫療之非藥物療法,經本中心查核屬實。 支持推動健康醫學,特此證明。

中華民國一〇三年十一月三日

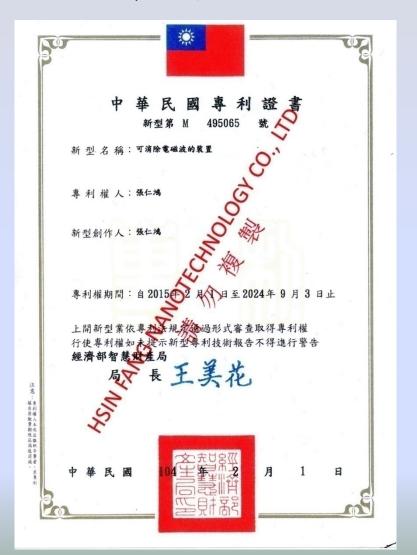
<mark>անը անանանան անանանական անանանան</mark>



#### 抗電磁波微粒材料 專利證號 I401701

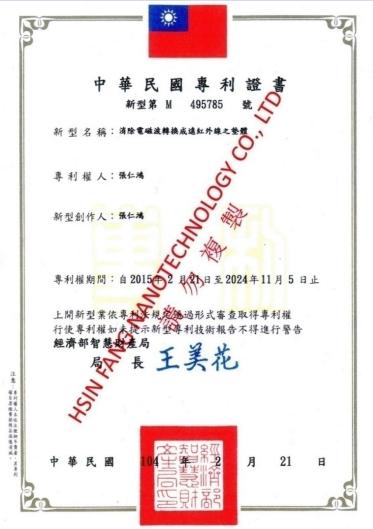


#### 可消除電磁波的裝置 專利證號 M495065

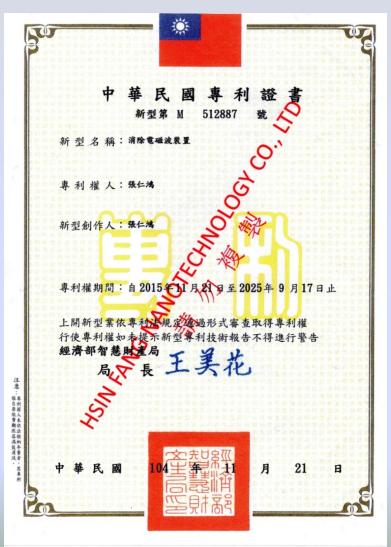




#### 消除電磁波轉換成 遠紅外線之墊體 專利證號 M495785



#### 消除電磁波裝置 專利證號 M512887



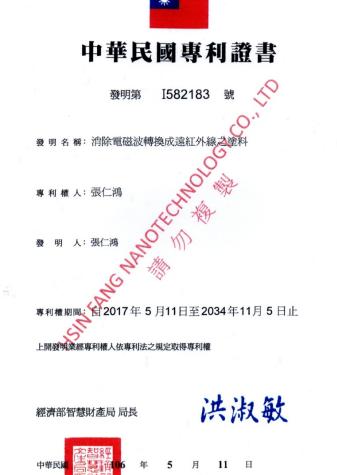


#### 抗電磁波膜 專利證號 M513119



消除電磁波轉換成 遠紅外線之塗料 專利證號 I582183



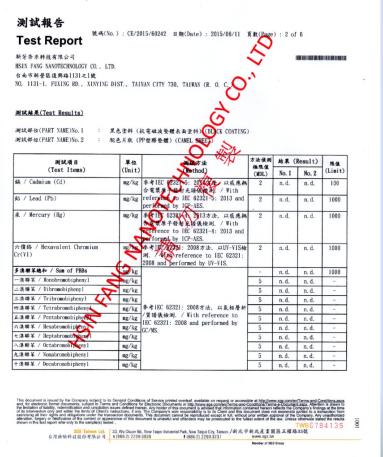


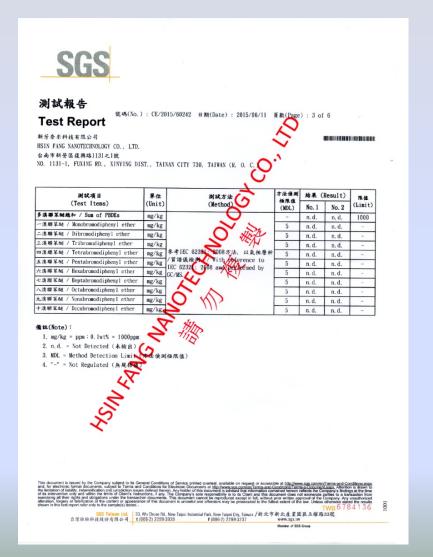
注意:專利權人未依法繳納年費者,其專利權自原繳費期限屆滿後消滅。



#### 新芳奈米輻射除轉墊符合歐盟 ROHS 1.0 多項安全環保檢測標準









#### 新芳奈米輻射除轉墊符合歐盟 ROHS 2.0 多項安全環保檢測標準



測試項目 (Test Items)	早位 (Unit)	测动方法 Method)	方法侦测 極限值	结果	(Result)	限值 (Limit
(lest Items)	(Unit)	Suernod) 47/1	(MDL)	No. 1	No. 2	)
新某二甲酸二異丁酯 / DIBP (Di- isobutyl phthalate) (CAS No.: 84- 69-5)	mg/kg	李考IEC 6234 8 (114/321/CD) · 以 直相 層析係/青 体系检测长/// 更ith reference to IEC/022478 (11) 321/CD). Analysis was performed by C/MD.	50	n. d.	n. d.	1000
解某二甲酸二丁酯 / DBP (Dibutyl phthalate) (CAS No.: 84-74-2)	mg/kg	大臣C 62321-8 (111/321/CD)・以気相 たら内質は保証之、/ With Deference to UEC 62321-8 (111/321/CD). Analysis was performed by 05/05	50	n. d.	n. d.	1000
郵某二甲酸丁苯甲酯 / BBP (Butyl Benzyl phthalate) (CAS No.: 85-68- 7)	- Maryar	条折15 62321-8 (111/321/CD)・以気相 層析保入資準係检測之、/ With reference to IEC 62321-8 (111/321/CD). Analysis was performed by GC/MS.	50	n. d.	n. d.	1000
# 第二甲酸二(2-乙基己基)酯(1994) (Di- (2-ethylhexyl) phthal (19)(CAS No.: 117-81-7)		参考IEC 62321-8 (111/321/CD)・以真相 層析係/質譜儀権測之 / With reference to IEC 62321-8 (111/321/CD), Analysis was performed by GC/MS.	50	n. d.	n. d.	1000
解某二甲酸二正辛酯 (DMS) (Di-n-octyl phthalate) (CSS No.: 117-84-0)	mg/kg	李考IEC 62321-8 (111/321/CD), 以氣相 層析儀/質譜儀檢測之, / With reference to IEC 62321-8 (111/321/CD). Analysis was performed by GC/MS.	50	n. d.	n. d.	-

SBS Taiwan Ltd. 33, Wu Chuan Rd. New Taipei Industrial Park. New Taipei City. Taiwan /新北市新北產業園區五權路33號 台灣軟廠科技股份有限公司 1(886.2) 2299.3939 1(886.2) 2299.3237 www.sgs.tw

Member of SGS Group





#### 消除電磁波的裝置--線組材料 UL證明

(VL)	CERTIFICATION	SDIRECTORY				
•		AVLV	2.E193578			
	Ap	pliance Wiring	Material - C	omponent		
Page Bottom						
	Ap	pliance Wiring	Material - C	omnonent		
		- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	material - C	Omponent		
ee General Inform	nation for Applian	ce Wiring Material - C	omponent	$\sim$		
	C WIRES & CAB			~	E193578	
A LANE 335 CHU NGGE DISTRICT	NG CHENG 3RD F	D		~.1		
EW TAIPEI, 239	TAIWAN		,	O.		
			, (			
		Table of Re	cognized Styles			
Single-con	ductor, thermo	plastic insulation.	~			
1007	1015	1185	1571	1617	TT	T
Multiple-co	nductor, therm	oplastic insulation.	O No	The state of the s		_
2464	2562	2854	2919	2990		T
2468	2733	2877	2969			
	Drint t	his page	Terms of Use	Pa	де Тор	
estions?	Fillics	1	11			
		3	11			2015 UL LLC
en the UL Leaf M	ark is on the prod	net or when the mon	d "Environment" i	s included in the I		
en the UL Leaf M Environment data	ark is on the proc	ar information regardi	ng this product's o	ertification.	UL Mark, please	search the
en the UL Leaf M Environment data appearance of a	ark is on the proc abase for addition company's name	or product in this dat	ng this product's c abase does not in	ertification.	UL Mark, please	search the
en the UL Leaf M Environment data an manufactured of ified and covered	ark is on the proc abase for addition company's name under UL's Follow under UL's Follow	or product in this dat. Up Service, Only those w-Up Service, Always	abase does not in se products bearing look for the Mark of	ertification. itself assure that g the UL Mark sho on the product.	UL Mark, please products so ide ould be conside	e search the ntifled have red to be
en the UL Leaf M Environment data appearance of a n manufactured u ified and covered permits the repro- litions: 1. The lean	ark is on the proc abase for addition company's name under UL's Follow I under UL's Follow duction of the ma ide information,	or product in this dat- Up Service. Only those w-Up Service. Always iterial contained in the Assemblies, Construct	ng this product's c abase does not in se products bearing look for the Mark of e Online Certifications, Designs, Sys	ertification.  itself assure that g the UL Mark sho on the product.  on Directory subjectems, and/or Cer	products so ide ould be conside ect to the follow tifications (files	e search the ntified have red to be
en the UL Leaf M Environment data appearance of a n manufactured i ified and covered permits the repro- ditions: 1. The Gu ented in their en	ark is on the proc abase for addition company's name under UL's Folion duction of the ma duction of the ma duction of the ma duction of the ma the process of the control of the control the top of the Colline	or product in this dat- Up Service. Only those V-Up Service. Always oterial contained in the Assemblies, Construct n-misleading maner.	ng this product's c abase does not in se products bearing look for the Mark of e Online Certificati tions, Designs, Sys , without any man	ertification.  itself assure that g the UL Mark sho on the product.  on Directory subjectems, and/or Cer inpulation of the d	products so ide ould be conside ect to the follow tifications (files ata (or drawing	e search the ntified have red to be ving ) must be is). 2. The
en the UL Leaf M Environment data appearance of a n manufactured i ified and covered permits the repro- ditions: 1. The Gu ented in their en	ark is on the proc abase for addition company's name under UL's Folion duction of the ma duction of the ma duction of the ma duction of the ma the process of the control of the control the top of the Colline	or product in this dat- Up Service. Only those w-Up Service. Always iterial contained in the Assemblies, Construct	ng this product's c abase does not in se products bearing look for the Mark of e Online Certificati tions, Designs, Sys , without any man	ertification.  itself assure that g the UL Mark sho on the product.  on Directory subjectems, and/or Cer inpulation of the d	products so ide ould be conside ect to the follow tifications (files ata (or drawing	e search the ntified have red to be ving ) must be is). 2. The
en the UL Leaf M Environment data appearance of a n manufactured u ified and covered permits the repro- bitions: 1. The Gu ented in their en ement "Reprintec acted material. Is	ark is on the proc abase for addition company's name under UL's Folion duction of the ma duction of the ma duction of the ma duction of the ma the process of the control of the control the top of the Colline	or product in this dat- Up Service. Only those V-Up Service. Always oterial contained in the Assemblies, Construct n-misleading maner.	ng this product's c abase does not in se products bearing look for the Mark of e Online Certificati tions, Designs, Sys , without any man	ertification.  itself assure that g the UL Mark sho on the product.  on Directory subjectems, and/or Cer inpulation of the d	products so ide ould be conside ect to the follow tifications (files ata (or drawing	e search the ntified have red to be ving ) must be is). 2. The
en the UL Leaf M Environment data appearance of a n manufactured u ified and covered permits the repro- bitions: 1. The Gu ented in their en ement "Reprintec acted material. Is	ark is on the proc abase for addition company's name under UL's Folion duction of the ma duction of the ma duction of the ma duction of the ma the process of the control of the control the top of the Colline	or product in this dat- Up Service. Only those V-Up Service. Always oterial contained in the Assemblies, Construct n-misleading maner.	ng this product's c abase does not in se products bearing look for the Mark of e Online Certificati tions, Designs, Sys , without any man	ertification.  itself assure that g the UL Mark sho on the product.  on Directory subjectems, and/or Cer inpulation of the d	products so ide ould be conside ect to the follow tifications (files ata (or drawing	e search the ntified have red to be ving ) must be is). 2. The
en the UL Leaf M Environment data appearance of a n manufactured u ified and covered permits the repro- bitions: 1. The Gu ented in their en ement "Reprintec acted material. Is	ark is on the proc abase for addition company's name under UL's Folion duction of the ma duction of the ma duction of the ma duction of the ma the process of the control of the control the top of the Colline	or product in this dat- Up Service. Only those V-Up Service. Always oterial contained in the Assemblies, Construct n-misleading maner.	ng this product's c abase does not in se products bearing look for the Mark of e Online Certificati tions, Designs, Sys , without any man	ertification.  itself assure that g the UL Mark sho on the product.  on Directory subjectems, and/or Cer inpulation of the d	products so ide ould be conside ect to the follow tifications (files ata (or drawing	e search the ntified have red to be ving ) must be is). 2. The
en the UL Leaf M Environment data appearance of a n manufactured u ified and covered permits the repro- bitions: 1. The Gu ented in their en ement "Reprintec acted material. Is	ark is on the proc abase for addition company's name under UL's Folion duction of the ma duction of the ma duction of the ma duction of the ma the process of the control of the control the top of the Colline	or product in this dat- Up Service. Only those V-Up Service. Always oterial contained in the Assemblies, Construct n-misleading maner.	ng this product's c abase does not in se products bearing look for the Mark of e Online Certificati tions, Designs, Sys , without any man	ertification.  itself assure that g the UL Mark sho on the product.  on Directory subjectems, and/or Cer inpulation of the d	products so ide ould be conside ect to the follow tifications (files ata (or drawing	e search the ntified have red to be ving ) must be is). 2. The
en the UL Leaf M Environment data appearance of a n manufactured u ified and covered permits the repro- bitions: 1. The Gu ented in their en ement "Reprintec acted material. Is	ark is on the proc abase for addition company's name under UL's Folion duction of the ma duction of the ma duction of the ma duction of the ma the of the Colline throw the Colline	or product in this dat- Up Service. Only those V-Up Service. Always oterial contained in the Assemblies, Construct n-misleading maner.	ng this product's c abase does not in se products bearing look for the Mark of e Online Certificati tions, Designs, Sys , without any man	ertification.  itself assure that g the UL Mark sho on the product.  on Directory subjectems, and/or Cer inpulation of the d	products so ide ould be conside ect to the follow tifications (files ata (or drawing	e search the ntified have red to be ving ) must be is). 2. The
en the UL Leaf M Environment data appearance of a n manufactured u ified and covered permits the repro- bitions: 1. The Gu ented in their en ement "Reprintec acted material. Is	ark is on the proc abase for addition company's name under UL's Folion duction of the ma duction of the ma duction of the ma duction of the ma the of the Colline throw the Colline	or product in this dat- Up Service. Only those V-Up Service. Always oterial contained in the Assemblies, Construct n-misleading maner.	ng this product's c abase does not in se products bearing look for the Mark of e Online Certificati tions, Designs, Sys , without any man	ertification.  itself assure that g the UL Mark sho on the product.  on Directory subjectems, and/or Cer inpulation of the d	products so ide ould be conside ect to the follow tifications (files ata (or drawing	e search the ntified have red to be ving ) must be is). 2. The
en the UL Leaf M Environment data appearance of a manufactured u lifled and covered ermits the repro- citions: 1. The Gu ented in their en ement "Reprintec acted material. Is	ark is on the proc abase for addition company's name under UL's Folion duction of the ma duction of the ma duction of the ma duction of the ma the of the Colline throw the Colline	or product in this dat- Up Service. Only those V-Up Service. Always v-Up Service. Always iterial contained in the Assemblies, Construct n-misleading maner.	ng this product's c abase does not in se products bearing look for the Mark of e Online Certificati tions, Designs, Sys , without any man	ertification.  itself assure that g the UL Mark sho on the product.  on Directory subjectems, and/or Cer inpulation of the d	products so ide ould be conside ect to the follow tifications (files ata (or drawing	e search the ntified have red to be ving ) must be is). 2. The

	產品認證	理器設備內部贏! 生產依據標準	lk_	UL 4:	結構標準	
UL2468   UL758   UL759   UL758   UL759   UL			炒機: 2-150 · No	s. 32-16AWG MA	龙纹線 裸铜或领	· 编却
UL2468 Pile No: E193578    Wild		1		絕緣體: P	VC 聚氯乙烯	
Mr						
機能健康		UL758				歷 300V
振照閲覧: 13 mis †	file No : E193578					
を使用: 抗熱療力   SOFE   1 (中央理 10分   10					- Bo 13mils [	
# 任後:					中長率 100%	
選子級解係:  UL Style & AWG Composition Of Thickness O.D.  SCSA Type AWG Composition Of Thickness O.D.  NO: nm					老化設定標準。	
UL Style	爱之的相故。		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	中長效率65%↑	設定額及 113°C	時間 168日
AWG Composition of Thickness O.D. mm			Conductor	NO.	lesulation	Nominal
No: ma		AWG				
26 7/0.160 2 0.38 1.494.2 mm (7/0.16) 0.38 1.495.6 mm (7/0.16) 0.38 1.495.6 mm (7/0.16) 0.38 1.495.7 mm (7/0.26) 0.38 1.495.4 mm (7/0.26) 0.38 1.495.4 mm (7/0.26) 0.38 1.595.0 mm (7/0.26) 0.38 1.595.0 mm (7/0.26) 0.38 1.595.6 mm (7/0.26) 0.38 1.595.6 mm (7/0.26) 0.38 1.595.5 mm (7/0.26) 0.38 1.795.5 mm (7/0.26) 0.38 1.795.5 mm (7/0.26) 0.38 1.795.5 mm (7/0.26) 0.38 1.795.5 mm (7/0.48) 0.38 1.995.7 mm (7/0.48) 0.38 1.995.7 mm (7/0.48) 0.38 1.295.7 mm (7/0.48) 0.38 2.195.3 mm (7/0.48) 0.38 2	CSA Type		NO: mm			
UL2468  (7/0.16)  (7/0.16)  (0.38				2	0.38	1.4x2.8 mm
UL2468	1	26		3_		
1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.		20	(7/0.16)	()		
大校後銀 24 7/0.263 2 0.38 1.5x4.5 mm 1.5x4.5	UL2468			6	-	
24	+ destruction Andre			0		
(11/0.16)	七秋夜蜓		7/0,203	3 4/20		
22   70.25    5   0.38   1.577.5 mm   1.793.4 mm   1.793.1 mm   20   2.00,18)   3   0.38   1.575.1 mm   1.895.7 mm   1.	統線	24	(11/0.16)			
17.0.1   17.0.1	The state of the s			. 5	0.38	
17/05.1 pm   17/05.1 pm   2   0.38   1.7/05.1 pm   2   0.38   1.5/05.7 pm   18   18   18   18   18   18   18   1		22		De	0.38	1.7x3.4 mm
18	-					
18 79.404 2 0.38 2.154(2 mm 1.401.18) 3 0.38 2.156(3 mm 1.401.18) 3 0.38 2.156(3 mm 1.401.18) 2 0.38 2.55(3 mm 1.401.18) 2 0.38 2 0.3	1	20				
16 34/0.18) 3 0.38 2.155,5 mm 16 (126)554, 3 0.38 2.055,0 mm 16 (126)554, 3 0.38 2.555,0 mm 17/0,488 2 0.38 2.555,0 mm 18/70/14/8名和結構,可当與時間支別附近 Conductor resistance is measured at 20°C ASIM American Society for Testing and Material.  ###################################	-					
16 (70,488 2 0.38 2.55.0 BE (150,5%) 3 0.38 2.55.0 BE (150,5%) 3 0.38 2.57.5 BE (150,5%) 4 0.38 2.57.5 BE (150,5%) 5 0.38	1	18				
: 浜列外規格和結構・可由供給を力階が Conductor resistance, is manured at 20°C ASIM American Society or Testing and Material. 学品が対抗動物合格 USIA Occupational Safety and Health Administration。 職業を予修事件理酬		16	7/0.488		-	
Conductor resistance is measured at 20°C ASIM American Society for Testing and Material.  #羅斯特科斯特會 #羅斯特科斯特會 #羅斯特斯特魯格 DSIA Occupational Safety and Health Administration. 職業を表演を管理時		- V				
Z. Z	ASIM American So VW-1 Pass a veri OSHA Occupations	ociety for Tes tical flame te al Safety and	ting and Materia	器高限地	5d5命会体	
	SI					
	1					
	T.					
***	T.					
	T.					
	T.					
	T.					
	T.					



# 各大院校教授群聯名推薦支持反輻射、抗電磁波、生技替代醫療

陳朝光成功大學機械工程系教授 蘇玉本中科院總顧問計畫總主持人 林榮慶台灣科技大學機械工程系教授 蔡穎堅 中山大學機械與機電工程教授 蕭庭郎 美國伊利諾大學航太系博士 楊條和台灣科技大學機械工程系教授 何正榮中央大學機械工程系主任 羅裕龍成功大學機械工程系教授 王偉中清華大學動力機械系教授 陳介力成功大學航太系教授 周煥銘 崑山科技大學機械工程系工學院院長 江寶釵 中正大學中國文學系教授 郭春寶中正大學機械系教授 馮展華 國立中正大學校長 謝光前 國立清華大學電機系教授兼奈微與材料科技中心主任 王覺寶國立成功大學航空太空工程研究所名譽教授 葉茂榮 前南榮科技大學校長、成大化學系主任

英國利物浦大學 機械工程研究所 博士 美國普林斯頓大學 航空機械 博士 美國普渡大學 工業工程所製造組博士 美國奧克拉荷馬州立大學 機械系 博士 美國伊利諾大學 航太工程 博士 美國俄亥俄州立大學 博士 美國加州大學 柏克萊校區 機械工程學系 博士 馬里蘭大學 帕克分校 機械工程 博士 美國愛荷華州立大學 工程力學 博士 英國曼徹斯特大學科技學院 控制研究所 博士 國立成功大學 機械工程研究所 博士 國立臺灣師範大學 文學 博士 美國伊利諾大學 機械工程 博士 國立交通大學 機械工程研究所 博士 美國伊利諾大學材料工程學系博士 美國喬治亞理工學院航太工程研究所 博士 日本東京工業大學 理學 博士



# 聯絡方式

公司地址: 台南市新營區復興路1131-1號

TEL: 06-6520707

FAX: 06-6534890

http://www.hsinfang.com.tw

E-MAIL:

hsinfangnano.antiemi@gmail.com nano@hsinfang.com.tw

### 歡迎來電洽詢或蒞臨指教

新芳奈米科技有限公司

版權所有

翻印必究